

ПОРОШОК ЖЕЛЕЗНЫЙ

Метод фотоэлектрического спектрального
анализа кремния, марганца и фосфора

ГОСТ

16412.9—91

Iron powder.

Method of photoelectric spectral analysis of silicon,
manganese and phosphorus

ОКСТУ 0809

Дата введения 01.07.92

Настоящий стандарт устанавливает фотоэлектрический метод определения кремния от 0,01 до 0,12%, марганца от 0,02 до 0,30% и фосфора от 0,01 до 0,04% в железном порошке.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Общие требования к методу анализа — по ГОСТ 28473.

2. СУЩНОСТЬ МЕТОДА

Метод основан на возбуждении и излучении атомов анализируемого образца электрическим разрядом, разложении излучения в спектр, измерении аналитических сигналов, пропорциональных интенсивности спектральных линий, и последующем определении значений массовой доли элементов с помощью градуировочных характеристик.

3. АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ

Фотоэлектрические вакуумные и воздушные установки индивидуальной градуировки.

Аргон газообразный первого и высшего сорта по ГОСТ 10157.

Электропечь для сушки и очистки аргона типа СУОЛ-0,4,4/12-Н2-У4,2.

Кондиционеры, обеспечивающие постоянную температуру и влажность воздуха в помещении.

Шлифовальный станок ЗЕ881.

Универсальный станок для заточки электродов КП-35.

Издание официальное

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР

40—60 по ГОСТ 6456 или другого типа, обеспечивающая необходимое качество заточки.

Для вакуумных фотоэлектрических установок используют постоянные электроды — медные, серебряные, вольфрамовые и титановые прутки диаметром 1—6 мм и графитовые стержни С-3, диаметром 6 мм.

Для воздушных фотоэлектрических установок используют медные прутки марки М00, М1, М2 по ГОСТ 858 и электроды графитовые, спектрально чистые, марки С-3 по нормативно-технической документации диаметром 6 мм длиной не менее 50 мм,

Пресс, обеспечивающий усилие не менее 70 кН.

4. ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗУ

4.1. Отбор проб проводят по ГОСТ 9849.

4.2. Отобранную пробу тщательно перемешивают, отбирая мерной частью железного порошка массой 5—6 г.

4.3. Брикетты прессуют в стальной пресс-форме с добавлением связки (порошок меди или графитовый порошок) без нее на прессе в течение 20 с с давлением, обеспечивающим достаточную прочность. Диаметр таблетки и ее высота должны соответствовать конструктивным параметрам фотоэлектрической установки.

4.4. Брикетты стандартных образцов предприятия (СОП) хранят в закрытых стеклянных банках.

4.5. Брикетты стандартных и анализируемых образцов перед анализом затачивают на шлифовальном станке.

4.6. Подготовку установки к выполнению измерений проводят в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

4.7. При фотоэлектрической регистрации спектра установление градуировочных характеристик осуществляют с помощью стандартных образцов (СО), аттестованных в соответствии с ГОСТ 8.315.

4.8. При первичной градуировке выполняют не менее пяти серий измерений в разные дни работы фотоэлектрической установки. В серии для каждого СО (пробы) проводят по две пары параллельных (выполняемых одно за другим на одной рабочей поверхности) измерений; при большом числе СО (проб) допускается выполнять по одной паре параллельных измерений. Порядок пар параллельных измерений рандомизируют. Вычисляют среднее арифметическое аналитического сигнала из всех 20 измерений для каждого СО (пробы). Для каждого анализируемого элемента устанавливают градуировочную характеристику как зависимость средних значений аналитических сигналов элемента от значений его массовой доли в стандартных образцах (пробах) методом наимень-

теристика выражают в виде графиков, таблиц, уравнений.

При использовании фотоэлектрической установки, управляемой компьютером, градуировку проводят в порядке, предусмотренном программой.

Допускается использовать градуировочные характеристики с введением поправок, корректирующих влияние химического состава.

4.9. Повторную градуировку выполняют в соответствии с п. 4.8, при этом допускается сокращение числа измерений.

4.10. При оперативной градуировке (метод трех эталонов) выполняют два параллельных измерения каждого СО. Допускается увеличение числа параллельных измерений до четырех.

5. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

5.1. Условия проведения анализа приведены в приложении.

5.2. Длины волн спектральных линий и диапазон значений массовой доли элементов приведены в приложении.

5.3. Допускается применение других условий проведения анализа и спектральных линий, обеспечивающих точность анализа, предусмотренную настоящим стандартом.

5.4. Для каждого определяемого элемента выполняются три параллельных измерения. Допускается выполнение двух или четырех параллельных измерений.

5.5. Значение массовой доли контролируемого элемента в пробе, представленной тремя образцами, находят как среднее арифметическое результатов трех измерений, полученных по одному от каждого из трех образцов.

6. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

6.1. Если расхождения значений аналитических сигналов, выраженные в единицах массовой доли не более $1,10 d_{сх}$ (см. табл. 3 приложения) — для четырех параллельных измерений, $d_{сх}$ — для трех параллельных измерений и $0,84 d_{сх}$ — для двух параллельных измерений, вычисляют среднее арифметическое.

В случае превышения величины допускаемых расхождений между результатами параллельных измерений, анализ повторяют после новой заточки пробы. Расхождения не должны превышать величин, указанных в табл. 3 приложения.

6.2. За окончательный результат анализа принимают среднее арифметическое двух, трех или четырех параллельных измерений, удовлетворяющих требованию п. 6.1.

первичного и повторного анализа превышают значения, указанные в табл. 3, делают дублирующую пробу.

6.4. Если для дублирующей пробы расхождения результатов трех измерений превышают допускаемые значения $d_{сх}$, выявляют и устраняют причины, вызвавшие повышенное рассеяние результатов измерений.

7. КОНТРОЛЬ ТОЧНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА

7.1. Контроль стабильности градуировочных характеристик

7.1.1. Не реже чем через 4 ч работы фотоэлектрической установки осуществляют контроль стабильности градуировочных характеристик для верхнего и нижнего пределов диапазона измерений.

Допускается выполнять контроль только для верхнего предела или только для середины диапазона измерений.

7.1.2. Стабильность градуировочных характеристик контролируют с помощью СО или однородных проб, для чего проводят два параллельных измерения. Допускается увеличение числа параллельных измерений до четырех. Расхождения значений аналитических сигналов, выраженных в единицах массовой доли, не должно превышать значений, указанных в п. 6.1 и табл. 3.

7.1.3. Если расхождение результатов параллельных измерений превышает допускаемое значение (см. п. 7.1.2), проводят повторные измерения аналитического сигнала для СО (пробы) в соответствии с п. 7.1.2.

7.1.4. Если расхождение результатов превышает допускаемое значение $0,5 d_v$ (см. табл. 3), то измерение повторяют в соответствии с пп. 7.1.2 и 7.1.3. При повторном превышении расхождения допускаемого значения осуществляют восстановление градуировочной характеристики регулировкой параметров установки или коррекцией результатов измерений введением поправок.

7.1.5. Внеочередной контроль стабильности осуществляют после ремонта или планово-профилактического осмотра фотоэлектрической установки.

7.2. Контроль воспроизводимости результатов анализа

7.2.1. Контроль воспроизводимости результатов анализа выполняют повторным определением массовой доли контролируемых элементов в проанализированных ранее пробах не реже одного раза в квартал.

7.2.2. Число повторных определений должно быть не менее 0,3% общего числа определений.

и повторного анализов, превышающих допустимое значение d_v (см. табл. 3). Если расхождение результатов первичного и повторного анализов превышает допустимое значение не более чем на 5% случаев, то воспроизводимость измерений считают удовлетворительной.

7.3. Контроль правильности результатов анализа

7.3.1. Контроль правильности проводят выборочным сравнением результатов спектрального анализа проб с результатами химического анализа, выполняемого стандартизованными или аттестованными в соответствии с ГОСТ 8.010 методиками, не реже одного раза в квартал.

7.3.2. Число результатов спектрального анализа, контролируемых методами химического анализа, устанавливается в соответствии с п. 7.2.2.

7.3.3. Вычисляют число расхождений результатов спектрального и химического анализов, превышающих допустимое значение d_v (см. табл. 3). Если расхождение результатов спектрального и химического анализов превышает допустимое значение не более чем в 5% случаев, то точность спектрального анализа считают согласованной с точностью химического анализа.

7.3.4. Допускается частично выполнять контроль правильности методом спектрального анализа на основе воспроизведения значений массовой доли элемента в стандартном образце предприятия.

Таблица 1

Условия проведения анализа

Контролируемые параметры	Воздушные фотоэлектрические установки		Контролируемые параметры	Вакуумные фотоэлектрические установки	
	МФС-4 генератор «Аркус»	МФС-6 генератор ИВС-28		ДФС-41	ДФС-51
Напряжение, В Частота, Гц Сила тока, А Аналитический промежуток, мм Время обжига, с Время экспозиции, с Электроды	220 50, 100 2,2 1,5 — 30	220 50, 100 4,0 1,5 — 30	Напряжение, В Емкость, мкФ Индуктивность, мкГн Частота, Гц Сопротивление, Ом Ширина выходных щелей Время продувки камеры аргоном, с Аналитический промежуток, мм Время обжига, с Время экспозиции, с	ИВС-1, ИВС-2	ИВС-6
	220 50, 100 2,2 1,5 — 30	220 50, 100 4,0 1,5 — 30	Напряжение, В Емкость, мкФ Индуктивность, мкГн Частота, Гц Сопротивление, Ом Ширина выходных щелей Время продувки камеры аргоном, с Аналитический промежуток, мм Время обжига, с Время экспозиции, с	600—650 12—40 180—500 150 0,1—16,9 0,04; 0,075 7—10	650 4—10 15—160 100—50 1—10 0,04; 0,075 7—10
	Угольный, заточенный на усеченный конус с площадкой диаметром 1,5 мм			2—6 10—75 5—20	2 10—75 5—20

**Длины волн спектральных линий и диапазоны значений
массовой доли элемента**

Определяемый элемент	Длина волны определяемого элемента, нм	Диапазон значений массовой доли элементов, %
Фосфор	178,29	0,004—0,15
	214,91	0,005—0,15
Кремний	251,6	0,01—1,50
	288,16	0,01—2,00
Марганец	263,82	0,02—2,20
	293,31	0,02—2,20
Железо*	241,33;	—
	259,9;	
	282,33	

* Элемент сравнения.

Таблица 3

Допускаемые расхождения между результатами параллельных измерений

Контролируемый элемент	Массовая доля, %	Допускаемые расхождения между результатами трех параллельных измерений $d_{сх}$, %	Допускаемые расхождения между результатами первичного и повторного анализа $d_{в}$, %
Фосфор	От 0,01 до 0,02 включ.	0,005	0,006
	Св. 0,02 > 0,04 >	0,008	0,010
Кремний	От 0,01 > 0,02 >	0,008	0,010
	Св. 0,02 > 0,05 >	0,013	0,016
	> 0,05 > 0,10 >	0,020	0,024
Марганец	> 0,10 > 0,12 >	0,025	0,030
	От 0,02 > 0,05 >	0,007	0,008
	Св. 0,05 > 0,10 >	0,010	0,011
	> 0,10 > 0,20 >	0,016	0,018
	> 0,20 > 0,30 >	0,025	0,030

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Академией наук УССР

РАЗРАБОТЧИКИ

В. Н. Клименко, канд. техн. наук; А. Е. Кущевский, канд. хим. наук; В. А. Дубок, канд. хим. наук (руководитель темы); В. И. Корнилова, канд. хим. наук; В. В. Гарбуз, канд. хим. наук; В. Д. Курочкин, канд. техн. наук; Л. Д. Бернацкая; А. К. Гайдученко, канд. техн. наук; Л. М. Дружинская; А. А. Заяц; Л. П. Семенютина

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 16.05.91 № 693

3. ВЗАМЕН ГОСТ 16412.9—80

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, раздела
ГОСТ 858—81	Разд. 2
ГОСТ 6456—82	Разд. 2
ГОСТ 9849—86	4.1
ГОСТ 10157—79	Разд. 2
ГОСТ 28473—90	Разд. 1

Редактор *И. В. Виноградская*
Технический редактор *Г. А. Терebinкина*
Корректор *И. Л. Асауленко*

Сдано в наб. 07.06.91 Подп. в печ. 27.09.91 3,5 усл. ш. л. 3,63 усл. кр.-отт. 3,20 уч.-изд. л.
Тир. 5000 Цена 1 р. 30 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 405